PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2003-002677

(43)Date of publication of application: 08.01.2003

(51)Int.Cl.

C03B 33/033 B23K 26/00 B23K 26/10 B23K 26/18 B28D 7/04 H01L 21/301 // B23K101:40

(21)Application number: 2001-190290 (22)Date of filing: 22 06 2001

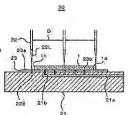
(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(72)Inventor · TAKELATSUSHI ITO HIDEHIRO

(54) SUPPORT TABLE FOR LASER CUTTING, APPARATUS AND METHOD FOR LASER CUTTING. AND METHOD FOR PRODUCING LIQUID CRYSTAL PANEL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new construction capable of preventing or reducing failures due to laser beam scattering when splitting a workpiece by laser cutting. SOLUTION: A laser cutting apparatus 20 comprises a support table 21 made of a rigid body such as metal and a laser irradiation system 22 adapted to allow scanning in horizontal direction (illustrated in the right and left direction) above the support table 21. A glass layer 23 is formed on the surface of the support table 21, and a glass substrate 1 which is the workpiece is held by suction on the glass laver 23. Since the glass layer 23 is formed so as to extend to the outside of the periphery of the substrate 1, the laser beam 22L can be prevented from scattering to cause a danger to the surroundings even if the laser beam 22L is off the substrate 1.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-2677 (P2003-2677A)

(43)公開日 平成15年1月8日(2003.1.8)

(51) Int.Cl.7		識別配号		FI			テーマコート (参考)			
C03B	33/033			CO.	3 B	33/033			2	H088
B 2 3 K	26/00	320		B 2	3 K	26/00		320	E 2	H090
	26/10					26/10			3	C069
	26/18					26/18			4	E068
B 2 8 D	7/04			B 2	8 D	7/04			4	G015
			審查請求	未請求	計算	で項の数23	OL	(全 10	(M	最終頁に続く
(21)出願番	9	特顧2001-190290(P20	01-190290)	(71)	出願人	000002	369			
						セイコ	ーエプ	ソン株式	会社	
(22) 出顧日		平成13年6月22日(2001.6.22)		1		東京都	新宿区	西新宿2	丁目44	番1号
				(72)	発明者	当 武居	厚			
								大和 3 丁 式会社内		5号 セイコ
				(72)	発明者	宇 伊藤	英博			
						長野県	諏訪市	大和3丁	目3番	5号 セイコ
						ーエブ	ソン株	式会社内		
				(74)	代理人	100095	728			
						弁理士	上柳	雅誉	OF 14	告)
										最終頁に続く

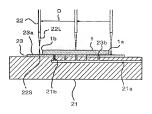
(54) 【発明の名称】 レーザ割断用支持テーブル、レーザ割断装置、レーザ割断方法、及び、液晶パネルの製造方法

(57)【要約】

【課題】 加工対象をレーザ割断によって分断する場合 に、レーザ光の散乱による不具合を防止若しくは低減で きる新規の構成を提供する。

【解決手段】 レーザ参斯流渡 2 0 は、金属等の解体か ちなる支持テーブル 2 1 上、この支持テーブル 2 1 の上、この支持テーブル 2 1 の上 たにおいて水平方向(図示た右方向)に走資可能に構成 されたレーザ照幹系 2 2 とを個えている。支持テーブル 2 3 の支証上にはガラス層 2 3 が形成され、このガラス 屋 2 3 の上に加工分象であるガラス製の試板 1 が整盤保 持されている。ガラス層 2 3 は基板 1 の外線よりも外側 に広がるように形成されているので、レーザ光 2 2 1 が 基板 1 からがすても、レーザと 2 1 が 様板 1 からで

危険を及ぼすことを防止できる。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を加工対象に照射して割断を行 う場合に加工対象を支持するためのレーザ剖断用の支持 テーブルであって、

テーブル表面の少なくとも一部に前記レーザ光を吸収す る光吸収面が殴けられていることを時後とする支持テー ブル。

【請求項2】 前記光吸収而はガラス面であることを特 徴とする結束項1に記載の支持テーブル。

【請求項3】 前記ガラス面は石英ガラスで構成されて 10 いることを特徴とする請求項2に記載の支持テーブル。 【請求項4】 前記加工対象を支持する支持領域内に開 口を有し、テーブル裏面における少なくとも開口縁の一 部表面に前記レーザ光を吸収する前記光吸収面が設けら れていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいず れか1項に記載の支持テーブル。

【請求項5】 前記光吸収面が少なくとも可視光に対し て光学的に平滑な面であることを特徴とする請求項1万 至請求項4のいずれか1項に記載の支持テーブル。

【請求項6】 レーザ光を支持テーブル上の加工対象に 20 照射して割断を行うレーザ割断装置であって、

前記支持テープルにおけるテーブル表面の少なくとも一 部に前記レーザ光を吸収する光吸収面が設けられている ことを特徴とするレーザ制断装置。

【請求項7】 前記光吸収面はガラス面であることを特 徴とする請求項6に記載のレーザ割断装置。

【請求項8】 前記ガラス面は石英ガラスで構成されて いることを特徴とする請求項7に記載のレーザ割新装

口を有し、テーブル裏面における少なくとも開口縁の一 部表面に前記レーザ光を吸収する光吸収面を有すること を特徴とする請求項6乃至請求項8のいずれか1項に記 裁のレーザ割断装置。

【請求項10】 前記光吸収面が前記レーザ光に対して 光学的に平滑な面であることを特徴とする請求項6万至 請求項9のいずれか1項に記載のレーザ割断装置。

【請求項11】 加工対象を支持面上で支持した状態で レーザ光を照射して割断するレーザ割断方法であって、 前記加工対象を、前記支持面の少なくとも一部を構成す 40 る前記レーザ光を吸収する光吸収面上で支持した状態で レーザ光を照射することを特徴とするレーザ制断方法。

【糖求項12】 前記光吸収面がガラス面であることを 特徴とする請求項11に記載のレーザ割断方法。

【請求項13】 前記ガラス面を石英ガラスで構成する ことを特徴とする請求項12に記載のレーザ割断方法。 【請求項14】 加工対象を支持面上で支持した状態で レーザ光を照射して割断するレーザ割断方法であって、 前記支持而を、前記加工対象の外線の外側に、前記レー ザ光を吸収する光吸収面が連続して露出する状態とし

て、レーザ光を照射することを特徴とするレーザ制断方

【請求項15】 前記光吸収面がガラス面であることを 特徴とするレーザ割断方法。

【請求項16】 前記ガラス面を石英ガラスで構成する ことを特徴とする請求項15に記載のレーザ制断方法。 【請求項17】 前記光吸収面を前記レーザ光に対して 光学的に平滑な面とすることを特徴とする請求項11万 至請求項16のいずれか1項に記載のレーザ割断方法。 【請求項18】 加工対象である、基板を貼り合わせて なる液晶パネルを支持面上で支持した状態でレーザ光を

照射して前記基板を割断する工程を有する液晶装置の製 造方法であって、 前記加工対象を、前記支持面の少なくとも一部を構成す

 新記レーザ光を吸収する光吸収面上で支持した状態 でレーザ光を照射することを特徴とする液晶パネルの製 造方法。

【請求項19】 加工対象である、藁板を貼り合わせて なる液晶パネルを支持面上で支持した状態でレーザ光を 照射して前記基板を割断する工程を有する液晶装置の製 造方法であって、

前記支持面を、前記加工対象の外縁の外側に、前記レー ザ光を吸収する光吸収面が連続して露出する状態とし て、レーザ光を照射することを特徴とする液晶パネルの 製造方法。

【請求項20】 前記光吸収面はガラス面であることを 特徴とする請求項18又は請求項19に記載の液晶パネ ルの製造方法。

【請求項21】 前記支持面を備えた支持体に開口を設 【請求項9】 前記加工対象を支持する支持領域内に開 so け、前記支持面上からレーザ光を照射するとともに前記 開口を通してレーザ光を照射することを特徴とする簡求 項18乃至請求項20のいずれか1項に記載の液晶パネ ルの製造方法。

> 【請求項22】 前記支持体の前記支持而とは反対側の 裏面のうち少なくとも開口線の一部に、前記レーザ光を 吸収する光吸収面を設けることを特徴とする請求項21 に記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項23】 前記光吸収面を前記レーザ光に対して 光学的に平滑な面とすることを特徴とする請求項18万 至請求項22のいずれか1項に記載の液晶パネルの製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

「発明の属する技術分野」本発明は、レーザ割断用支持 テーブル、レーザ割断装置、レーザ割断方法、及び、液 晶パネルの製造方法に係り、特に、ガラス板をレーザ光 によって割断する場合に好適な技術に関する。

[00002]

【従来の技術】一般に、液晶パネルは、一対のガラス製 50 の基板を合成樹脂等からなるシール材を介して貼り合

せ、シール材の内側に液晶を封入することによって形成 される。ここで、大判基板同士をシール材で貼り合せて 大判パネルを形成した後に、基板を分断して複数の液晶 パネルを分割形成する場合がある。

【0003】ガラス製の基板を分割する方法としては、 例えば、基板表面にスクライブ溝を形成し、このスクラ イブ溝に沿って外部応力 (折割力) を加えることにより 基板を破断させるスクライブ・プレイク法が知られてい る。しかしながら、このスクライブ・プレイク法には、 チッピングによる憲囲の汚染や破断而形状の不安定性が あるため、近年、これらを解決する方法としてレーザ光 を用いたレーザ割断による基板分割が行われるようにな ってきた。

【0004】レーザ制断による基板分割においては、通 常、図10に示すように、レーザ制断装置10に設けら れた金属製の支持テーブル11上に基板1を配置し、基 板端部1 a に図示しない切り欠き (クラック) を形成 し、この切り欠きの形成部位からレーザ照射系12によ りレーザ光を照射しはじめ、レーザ光の照射スポットを 分割予定線に沿って図示の走査方向Dへ移動させていく 20 る。 ことにより、切り欠きの形成部位から基板を徐々に破断 させ、最終的に反対側の基板端部1bまでレーザ光を走 査していくことにより、基板1を分割するようにしてい

【0005】レーザ割断の原理は、レーザ光が照射され る基板部分が加熱されると基板内部に圧縮応力が生ずる が、その後レーザスポットが移動すると温度が降下して 基板内部に引張応力が発生し、この引張応力によって基 板が引裂かれるようにして破断されるものと考えられて いる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の レーザ割断による基板分割方法においては、一方の基板 端部1aから他方の基板端部1bまでレーザ光を走査し ていく必要があり、特に、レーザ割断による基板分割に おいては、レーザ光の走査開始位置と走査終了位置とで 基板の破断状態が不安定になることもあり、基板端部1 aから基板端部1bまで確実に基板1を割断しようとす れば、レーザスポットが基板端部1aの手前から基板幅 部1 b を越えた位置まで移動するように走査を行う必要 40 がある。このとき、レーザ光が基板1の外形の外側にお いて支持テーブル11の表面に照射されると、支持テー ブル11の表面は一般に光学的に粗面である金属表面で 構成されているため、図示のようにレーザ光が周囲に散 まする。

【0007】上記のようにレーザ光が支持テーブル1の 表面に照射され、レーザ光が散乱されると、基板1の端 面にレーザ光が照射されることにより、基板1の熱分布 が不安定になり割断 (破断)線が分割予定線からずれる ことがある。また、散乱光が観測機器(CCDカメラな so

ど) や作業者に当たり、観測機器や作業者に損傷を与え る危険性もある。特に、ガラス製の基板を割断するのに 用いるレーザ光は、ガラスに効率的に吸収され得る光波 長域を有するレーザ装置、例えば赤外領域の光を発する 炭酸ガスレーザ装置などを用いることが多いので、レー ず光を肉眼で視認することができず、危険性がより高く なる。また、作業者等を防護するためにレーザ割断装置 にレーザ照射部分を取り囲む透明パネル等の防護設備を 設置しなければならない場合もある。

【0008】そこで本発明は上記問題点を解決するもの であり、その課題は、加工対象をレーザ割断によって分 断する場合に、レーザ光の散乱による不具合を防止若し くは低減できる新規の構成を提供することにある。

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明の支持テーブル は、レーザ光を加工対象に照射して割断を行う場合に加 工対象を支持するためのレーザ割断用の支持テーブルで あって、テーブル表面の少なくとも一部に前記レーザ光 を吸収する光吸収面が設けられていることを特徴とす

【0010】この発明によれば、テーブル表面の少なく とも一部に光吸収面が設けられていることにより、レー ザ光がテーブル表面に照射された場合に、レーザ光が光 吸収面で吸収されるため、周囲に散乱される光量を低減 することができる。この場合、光吸収面はガラス面であ ることが好ましい。この場合には、加工対象としてガラ スを割断する場合に、レーザ光を良好に吸収することが できる。特に、加工対象のガラスとほぼ同僧或いはほぼ 同様の光学的性質を有するガラス層で構成することが望 30 ましい。

【0011】本発明において、前記ガラス面は石筆ガラ スで構成されていることが好ましい。石英ガラスは耐熱 性及び機械的強度が高く、熱膨張係数も小さいので、レ 一ザ光によって局部的に加熱されても変形しにくく、か つ、破断される恐れも低い。また、不純物も少ないの で、加工対象を汚染することもない。

【0012】本発明において、前記加工対象を支持する

支持領域内に開口を有し、テーブル裏面における少なく とも開口縁の一部表面に、前記レーザ光を吸収する光吸 収面が設けられていることが好ましい。支持テーブルに 開口が形成されていることにより、加工対象に対して支 持テーブルの表裏いずれの側からもレーザ光を照射する ことが可能になる。また、テーブル裏面の開口縁の少な くとも一部に光吸収面を有することにより、支持テーブ ルの裏面側から光を照射した場合にも、当該光吸収面に よってレーザ光の散乱を低減することができる。

【0013】本発明において、前記光吸収面が少なくと も可視光に対して光学的に平滑な面であることが好まし い。光吸収面が少なくとも可視光に対して光学的に平滑 な面、すなわち、外見的に平滑面として視認される程度 の高に形成されていることにより、レーザ分が開終され た場合に表面反射が生じにくいので、レーザ光はほとん ど微乱されないこととなり、予期しない方向にレーザ光 が放射されることを防止できる。なお、ガラスを加工対 象とする場合には、当該ガラスに表やれわやすいを 受ける場合には、当該ガラスに表やれわやすいを サブナが用いられるので、ガラス面によりレー ザ光が吸収されやすくなるが、その一部はガラス面で正 反数まれ得る。

【0014】次に、本発炉のレー労削所連開は、レーザ 水を支持テーブル上の加工対象に照射して削断を行うレ ーザ削断設置であって、前記之特テーブルにおけるテー ブル表面の少なくとも一部に前記レーザ光を吸収する光 吸収値が続けられていることが好ましい。この光波収面 はガラス値であることが存ました。

【0015】本発明において、前記ガラス面は石英ガラ スで構成されていることが好ましい。

[0016] 本発明において、前記加工対象を支持する 支持領域内に第口を有し、テーブル裏面における少なく とも開口線の一部表面に、前記レーザ光を汲収する光吸 収面が駆けられていることが好ましい。

[0017] 本朝原において、前沿光泉収面が輸起レー 労光に対して光学的に平滑を面であることが好ましい。 [0018] 次に、本発明のレーザ制筋方法は、加工対 象であるガラスを支稽面上で支持した状態でレーザ光を 振着して削断するレーザ制筋方法であって、前記加工対 象を、前記支荷画の少なくとも一部を構成する、前記レーザ光を 原材することを特徴とする。ことで、光泉収面はガラ ス面であることとが衰しい。

【0019】本発明において、前記ガラス面を石英ガラ 30 スで構成することが好ましい。

【0020】また、別のレーギ部所方法は、加工対象を支持前上で支持した状態でレーザ光を照射して割断するレーザ制的方法であって、制定支持商を、前記加工対象の外郷の外郷に、前記レーザ光を吸收する光吸収重が進続して調出する状態として、レーザ光を照射することを特徴まする。この発明によれば、加工対象を支持前上で支持した場合に、加工対象の外線に対して連続して、前記レーザ光を吸収する光吸液面が遅出するように支持前を帰収しているので、加工対象の対象からレーザ光が外4れても、光吸収面上にレーザ光が照射されることとなるので、レーザ光の版名を洗漬することができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることができる。ここで、光吸収面はガラス面であることがません。

【0021】本発明において、前記ガラス面を石英ガラスで構成することが好ましい。

[0022] 本売別において、前記が現板直を削記し一 ザがた対してが分的に「特定電子することが撃士しい。 (0023] 次に、本発序の液晶パネルの製造方法は、 加工対象である。基板を沿り合わせてなる液温パネルを 支持血上で支持したが繁官レーサが発展制して流流温板。 するレーザが2の照射方角は、限示のように照射面に対し するレーザが2の照射方角は、限示のように照射面に対し

を制所する工程を有する液晶装置の製造方法であって、 前記加工対象を、前記支持面の少なくとも一部を構成す る、前記レーザ光を吸収する光吸収面上で支持した状態 でレーザ光を照射することを特徴とする。

[0024]また、別の態品/ネルの製造方法は、加工 対象である、凝板を貼り合わせてなる液晶パネルを支持 面上で支持した実態でレーザ光を照射して前記基版を割 筋する工剤を有する液晶装置の脚造方法であって、前記 支持商を、前記加工対象の外線の外側に、前記レーザ光 を吸収する光吸収面が建設して舞出する状態として、レ 一ザ光を照射することを特徴とする。

【0025】本発明において、光吸収面はガラス面であることが好ましい。

【0026】本発明において、前記支持面を備えた支持 体に開口を設け、前記支持面上からレーザ光を照射する とともに前記回口を通してレーザ光を照射することが好ましい。

【0027】本発明において、前記支持体の前記支持面 とは反対側の裏面のうち少なくとも開口線の一部に、前 記レーザ光を吸収する光吸収面を設けることが好まし

【0028】本搾明において、前記光歌坂面を前記レーザ光に対して光搾物に下得食面とすることが好ましい。 「0029】なお、上記を得頭において、光変み面は、 支持テーブルの基材上に光歌収性素材からなる層(光吸 収削)を脱することによって構成することができる。 [0030]

【発明の実施の形態】次に、添付区面を参照して本発明 に係るレーザ創新用支持テーブル、レーザ創新装置、レ ーザ削新方法、及び、液晶パネルの製造方法の実施形態 はついて経緯に影明する。

【003.1】【第1実施形態】最初に、レーザ制所用支持テーブル、レーザ制所支援。レーザ制所方法に関する、本契例の第1実施形態について設別する。図1は、第1実施形態のレーザ削所装置20の認能構成及びこの装置においてガラスからなるが近1を削折しているポテーズの機体からなる支持アーブル21と、この支持アーブル21の上方において水平方角(図示左右方向)に走送の間に振聴変されたし一型服装系。2とを備えている。

100321レーザ駅網系22は、関京しないレーザ発 振器と、このレーザ発展器から放出されたレーザ光を く場外手段と、レーザ光の原料位置を制御する制御手段 とを含む、レーザ発展器としては、開催ガスレーザなど の原体レーザ発展器、収むは、半線化レーザや学結 し一ザなどの国体レーザ発振器を用いることができる。 発掘資産は、加工対象であるガラスに負がた吸皮されば な変長級、例えば外外線は上窓される。加工対象に対 するレーザ光の原料を加まれば、同ぶのように服装部に対して がは他がなったが、またが、雨やまる方句に びはばかなったが、雨やまる方句に ではばかなったが、雨やまる方句に ではばかなったが、雨やまる方句に 対してやや傾斜した方向であっても構わない。

【0034】通常、ガラス製の基板1の基板端部1aに は、図示しない切り欠き、クラック、或いは、スクライ ブ満などからなる傷痕が形成され、この基板端部1aか ら走査方向Dに向けて直線的にレーザ光22Lが走査さ れる。ただし、レーザ割断法としては、このような典型 的な方法に限られない。例えば、レーザ制断時において は、基板1の端部近傍のレーザ走査開始点やレーザ走査 終了点では熱分布が不安定になることにより割断線が予 定ラインからずれてしまう場合が多いので、図6 (a) に示すように、基板端部1aと1bの双方に傷痕2a. 2 b を形成し、一方の傷痕 2 a の形成部位をレーザ走査 開始点とし、他方の傷痕2bの形成部位をレーザ走査終 了点とする場合がある。また、図6 (b) に示すよう に、傷痕2a、2bに加えて、それらの傷痕間において も1又は複数の傷痕2cを形成する場合がある。さらに は、図示しないが、基板端部1aから基板端部1bまで の全体に亘って伸びるスクライブ溝を形成する場合もあ る。また、レーザ光の走査は直線的なものである必要も なく、曲線状の分割予定線に沿って曲線状に走査するよ うにしても構わない。

[0035]上記いずれの方法であっても、レーザ光2 2 L が基板1の表面に照射されてなるレーザスポット 2 S はレーザ走生方向D に沿って移動し、レーザスポット 2 2 S よりもやや遅れた郵位において基板1 に破断が 生ずる。この線所はレーザ走査方向D に沿った割手で かて基板1 はレーザ走査方向D に沿った割断面で分断 される。

【0036】本家施売能においては、支持テーブル21 の表面上にガラス編23が形式される。このガラス機2 3は、ガラス板を支持テーブル21上に截置しただけの ものであってもよく、或いは、支持テーブル21の表面 上に維持されたり、被着されたりしたガラス裏であって もよい。ガラス層は落本的に上記加工列象のガラスと同様に各座ガラスを含む範囲内の素材からなるものであれ ばよく、評確第カラスに関係すれない。

【0037】ガラス層23は、支持テーブル21上において、加工対象である基板1よりも一回り大きく形成されており、基板1の外線、より具体的にはレーザ走査方向Dの外線である基板開路1aと1bから外側に張り出すように配置されている。その結果、ガラス層23は、

基板1の外線(基板端部1a, 1b)の外側に連続して そのガラス面が露出するように設けられていることとな ×

【0038】また、ガラス層23の炎雨23 aは、少なくともその露出部分にないて平滑面となるように構成されている。ここで平滑面とからのは、少なくをもレーザ 光221に対しては光学的に平坦な面として作用する面を言う。したがって、ガラス線23にレーザ光221が 銀針されても、表面23 aにおいてはほとんど光鋭乱を 生ずることはなく、レーザ光221の多くはガラス層2 3に吸収され、その一部が表面23 aにて正反射され

【0039】な私、支持デーブル21は、加工対象である基板 1を敷着作するための、非気温路21a足びCの排気温器21a圧温道した設計税21bを増え21b定温道5 る間口23bが形成されている。したかって、非気温路21a定変を削減処置等上掛きするとにより、吸引孔21bに適当なことにより、吸引孔21bを適して排気が行われ、基板1は支持テーブル21上に映像を供きする。

【0041】 第2実施形態】次に、例2を参照して本 発明に係る第2実施形態について説明する。この実施形 第のレーザ前所装置30は、第1実施形態のレーザ前所 装置20と同様の支持テーブル31 (持気道路31a、 の 労引孔31b) 及びレーザ前計系32 (レーザが32 し、レーザスポット325) を備えているので、これら

の説明は省略する。

【0042】この実施形態のレーザ割断装置30においては、支持テーブル31上にガラス層33が設けられている。このガラス層33の東材は上駐第1実施形態と同様である。このガラス層33の中央部には開口33bが形成され、その結果、基度1は、その外線部近待においてのみガラス層33に支持された状態とっている。 【0043】この実施形響では、加工対象である基度1

50 の外形の外側においては第1実施形態と全く同様に構成

されているので、上記第1実施形態と全く同様の作用効 果を奉する。なお、第1実施形態や本実施形態のように 基板 1 がガラス層に支持されている必要は必ずしもな く、加工対象の外級より外類に、その外級と連続してガ ラス面が露出するように設けられていればよい。

【0044】「第3実施形態】次に、図3乃至図5を参 昭して、本発明に係る液品パネルの製造方法の実施形態 について説明する。製造方法について述べる前に、最初 に、本発明の製造方法の対象となる液晶パネルの構造を 図7及び図8に基づき説明する。ここで、図7は液晶パ 10 ネル50の概略平面図であり、図8は液晶パネル50の 樹略断面図である。

【0045】被晶パネル50は、ガラス製の基板51と 基板52とをシール材53により貼り合せたものであ り、シール材53に形成された開口53aから液晶55 を注入した後に、開口53aを封止材54によって封鎖 したものである。基板51の表面上には、図8に示すよ うに I T O (インジウムスズ酸化物) などの透明導電体 からなる質極51 aが形成され、この電極51 aは、基 板51における基板52の外形よりも外側へ張り出して なる基板専出部51T上に引き出されるように形成され た配線51cと一体に形成されている。電極51aの表 而上にはポリイミド樹脂等からなる配向膜51bが形成 されている。また、基板52の表面上には、上記と同様 の透明導電体からなる電極52aが形成され、その上に 上記と同様の配向膜52bが形成されている。電極52 aは、シール材53や別途形成された上下導通部などを 介して基板51の基板張出部51T上に設けられた配線 51 dに導露接続されている。

[0046] 配線51c. 51dは基板張出部51T上 30 に実装された半導体IC56に導電接続されている。こ の半導体IC56は、例えば、液晶パネルを駆動するた めの液晶駆動用ICであり、基板張出部51Tの端縁近 傍に形成された入力端子51eにも濃電接続されてい る。

【0047】上記液晶パネル50を製造する場合には、 図9に示すように、上記液晶パネル50の一部となるべ を領域を複数含むように構成された大判基板510と5 20とをシール材によって貼り合せた大判パネル500 を形成し、この大判パネル500を、図9(a)に示す 40 図示X方向に伸びる分割予定線500xに沿って分断し て、図9(b)に示す短冊状の中間パネル501を形成 する。この中間パネル501においては、シール材の開 口がパネル端に露出するように構成されるので、この開 口から液晶を注入し、その後、封止材によって開口を封 鎖する。次に、図9 (c) に示すように、中間パネル5 0 1を図示 Y 方向に伸びる分割予定線 5 0 0 y に沿って 分断することにより、図9 (d) に示すように、基板5 52を有する液品パネル50が形成される。

【0048】上記の液晶パネル50の製造方法において so 【0053】支持体46は、支持テーブル45に接続さ

は、 上記大判パネル500を分割する分割工程と、上記 中間パネル501を分割する分割工程とにおいてそれぞ れ図3に示すレーザ割断装置40を用いることができ る。なお、以下の説明においては、大判パネル500を 分割する場合について説明するが、本実施形態の分割工 程及びレーザ割断装置は、この場合に限られるものでは ない。

10

【0049】図3に示すように、レーザ制能装置40 は、一気のレーザ発振器41、42と、このレーザ発振 器41、42から放出されるレーザ光を加工対象に導 き、集光するための照射光学系43、44と、加工対象 (大半パネル500) を保持するための支持テーブル4 5と、支持テーブル45を支持する支持体46と、支持 体46を駆動して加工対象の位置及び姿勢を調整するた めの駆動機構47と、上記レーザ発振器41、42、照 射光学系43,44、及び、駆動機構47を制御するた めの制御部48とを備えている。

【0050】レーザ発振器41、42としては、CO2 レーザ等の気体レーザ、YAGレーザ等の固体レーザ、 或いは、半導体レーザその他の各種レーザ発振器を用い ることができるが、加工対象の光吸収特性を勘察して、 加工対象が有効に吸収しうる帯域の発振波長を備えたも のを選定する必要がある。例えば、液晶パネルの基板材 料として一般的に用いられるソーダガラス、ホウ珪酸ガ ラス、石英ガラス等のガラス材料(シリカガラス)を加 工対象とする場合には、СО2 レーザを用いることがで きる。このレーザ発振器41、42は、その発振出力 (光パワー) を外部から制御できるように構成されてい

【0051】照射光学系43、44としては、通常、図 示の反射ミラー及び集光レンズを備えたものがあるが、 導光経路や照射スポット径に応じて適宜の光学的構成を 野計することができる。この照射光学系43.44は、 その導光経路及び照射スポット径(集光特性)を外部か ら制御できるようになっている。

【0052】 支持テーブル45は、大判パネル500を 裁置可能(好ましくは固定可能)に構成されている。支 持テーブル45は、大判パネル500を裁置又は固定す る面とは反対側から (図示下方から) 光を照射できるよ うに、例えば、図9に示す分割予定線500xに沿って スリット状に形成された閉口45aを備えている。この 開口45aは物理的な開口部であっても、或いは、レー ザ光を透過可能な素材で構成された光学的開口であって もよい。支持テーブル45は加工対象の大きさ、分割予 定線の位置や方向によって取付姿勢を変えることができ るように構成されていることが好ましい。また、異なる 形状の支持テーブルを交換することができるように支持 体46に着脱可能に取り付けられていることが好まし

れているとともに、駆動機構47によって水平方向及び 垂直方向に移動可能に構成されている。支持体46を駆 動する駆動機構47は、支持体46を水平方向及び垂直 方向に移動できるように構成されている。

【0054】制御部48は、上記レーザ発振器41.4 2の発振出力、照射光学系43,44の導光経路及び集 光特性、並びに、駆動機構 4 7 の駆動の有無及び位置を それぞれ調整可能に構成されている。また、レーザ発振 器41、42が発振波長を切り換え可能に構成されてい る場合には、制御部48は発振波長を制御可能に構成さ 10 れていることが好ましい。さらに、レーザ光の照射スポ ットをパネル上で歪沓する場合、パネルの所定部位にお ける照射エネルギー量(密度)はレーザ出力に比例し、 照射スポットの走査速度に反比例する。一方、基板の制 断作用はレーザ光の照射エネルギー量 (密度) に正の相 関を有するので、制断作用を良好な状態に維持するため に、レーザ出力と照射スポットの走査速度とを制御部4 8にて制御し、照射エネルギー量(密度)が所定範囲内 に収まるように調整することが好ましい。

【0055】本実施形態においては、上記のレーザ割断 20 装置40を用いることにより、大利パネル10の表裏の 大判基板510と520とを、それぞれに上述の第1実 施形態と同様に形成された傷痕から分割予定線500x (図9参照) に沿ってレーザ光を照射することにより同 時に破断させる。ここで、上記レーザ光の照射後の温度 降下によって生ずる引張応力の発生を助長するために、 レーザ光の照射スポットよりもやや走査方向後方位置に 気流の吹き付けなどで冷却を行うことも可能である。

【0056】図4は、上記支持テーブル45の拡大断面 図であり、図5は、支持テーブル45の平前図(a)、 30 正面図(b)及び断面図(c)である。支持テーブル4 5には複数のスリット状の開口45aが並列形成され、 図5(a)に示すように大判パネル500を裁置させる と、図9に示す複数の上記分割予定線500xがちょう ど開口 4 5 a 上にそれぞれ位置するように構成されてい る。支持テーブル45内には、上記複数の開口45aに 沿って伸びる排気経路45 bが形成され、この排気経路 45 bは、開口 45 aに沿って配列された複数の吸引孔 45cに連通している。排気経路45bは支持テーブル 45の側面に取り付けられた接続具45dを経て図示し 40 ない排気装置に接続される。

【0057】支持テーブル45は、金属等の関体からな るテーブル基材451と、このテーブル基材451の表 裏両側に形成されたガラス層452、453とから構成 されている。ガラス層 4 5 2、 4 5 3 の表面 4 5 2 a、 453 aは、レーザ光に対して光学的に平滑に形成され ている。ガラス層 4 5 2、 4 5 3 には、上記吸引孔 4 5 c を露出するためのスリット状の閉口部 4 5 2 b. 4 5 3 bが形成されている。

【0058】尚、本発明の基板分割方法及び液晶装置の 50 45a 開口

製造方法は、上述の図示例にのみ限定されるものではな く、本発明の要旨を逸脱しない節囲内において種々変更 を加え得ることは勿論である。

【0059】例えば、上記各実施形態においては、いず れも光吸収層としてガラス層を用いているが、使用する レーザ光を有効に吸収し得る層若しくは面が設けられる ものであればよく、例えば、セラミックスやシリコン結 **晶などで構成することも可能である。**

【0060】また、上記各字施形態はいずれも支持テー ブルの表面にガラス層が設けられた構成を有している が、支持テープルをガラスなどの光吸収材のみで構成し ても構わない。

[0061]

【発明の効果】以上、説明したように本発明によれば、 レーザ光が加工対象から外れてもレーザ光の散乱による 被害の発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明に係るレーザ割断用の支持テーブル、レ

ーザ割断装置及びレーザ割断方法の第1 実施形態を示す 機略断面図である。 【図2】本発明に係るレーザ割断用の支持テーブル、レ

ーザ割断装置及びレーザ割断方法の第2実施形態を示す 概略断面図である。 【図3】本発明に係る液晶装置の製造方法に用いるレー

ザ剖断装置の第3実施形態を示す概略構成図である。 【図4】第3実施形態の支持テーブルの拡大断而変であ

【図5】第3実施形線の支持テーブルの平面図(a). 正面図 (b) 及び断面図 (c) である。

【図6】レーザ割断時の様子を示す説明斜視図(a)及 び (b) である。

【図7】第3実施形態によって形成される液晶パネルの 概略平面図である。

【図8】第3実施形態によって形成される液晶パネルの **艇略断面図である。**

【図9】液晶パネルの製造方法の概略工程を示す工程説 明図(a)~(d)である。

【図10】従来のレーザ割断の様子を示す概略説明斯面 図である。

【符号の説明】

1、51.52 非板 2a, 2b, 2c 傷痕

20,30,40 レーザ割断装置

21,31,45 支持テーブル

22.32 レーザ照射系

221 レーザ光

228 レーザスポット

23,33,452,453 ガラス層 23a, 33a, 452a, 453a 表面

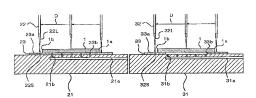
50 液晶パネル

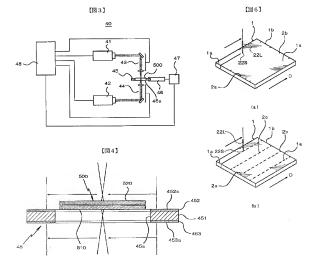
501 中間パネル

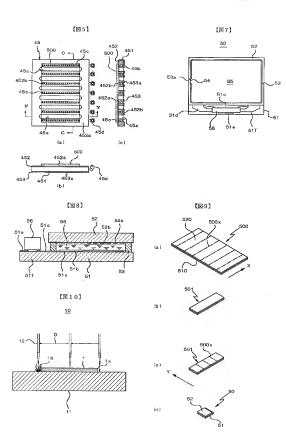
500 大判パネル

[図1] 20

【図2】 30







フロントページの続き

(51) Int.C1.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G O 2 F 1/13	101	G O 2 F 1/13	1 0 1
1/1333	500	1/1333	500
HO1L 21/301		B 2 3 K 101:40	
// B 2 3 K 101:40		H O 1 L 21/78	В -

F ターム(参考) 2H088 FA06 FA07 HA01 MA20 2H090 JB02 JC13

3C069 AA01 BA08 BB04 CA11 CB01

DA01 EA01 EA05

4E068 ADOO AE00 CE09 CF00 CF03 DA09 DB13

4G015 FA06 FB01 FC11